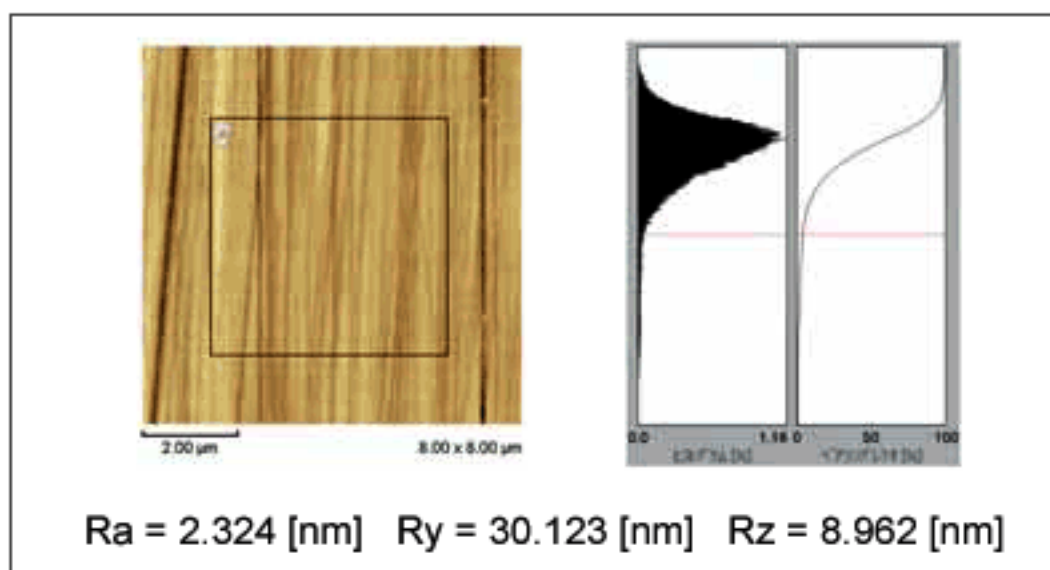


光盘类材料的应用实例



上图为硬盘表面纹理的研磨痕迹。SPM（扫描探针显微镜）可在大气中、无喷镀、无损地精密观察三维形貌。该图像还可由计算机处理，因此，除图像观察（左图倍率约5000倍）外，还可方便地计算如右图所示的表面粗糙度、频率分布图、方位比等。

通过SPM对纹理、激光修补、凹痕、膜厚、落差

等的精密测定，为光盘、晶片的制造管理、工艺开发提供传统的触针式粗糙计、电子显微镜无法获得的数据。

随着光盘媒体向高密度化发展，SPM作为微粗糙度测定的强有力工具，其用途必将不断增加。